



E-Actu n°33 : Actualités du Département « Instrumentation Scientifique – MILEXIA FRANCE »

Milexia France commercialise dorénavant en France la gamme des AFM de laboratoire Hitachi.

Plusieurs modèles sont disponibles :

AFM 5100N



Un modèle compact, polyvalent et multi-modes. La fonction unique « Self Sensing Detector » procure une très grande facilité d'utilisation. Il n'est en effet pas nécessaire d'utiliser un laser pour aligner le détecteur.

AFM 5300E



Une solution idéale pour mener des observations d'extrême surface dans de multiples environnements. Sous air, sous vide, sous contraintes thermiques (-120°C à +800°C), sous humidité contrôlée, en milieu liquide.

Vacuum System

- High resolution observations of electromagnetic properties
- High temperature and cryogenic measurements

In-situ Observation

- In Air or in Solution
- Humidity control
- Temperature control

Air Protection

- SEM and Ion Milling compatible sample holder

Environmental Control Unit:

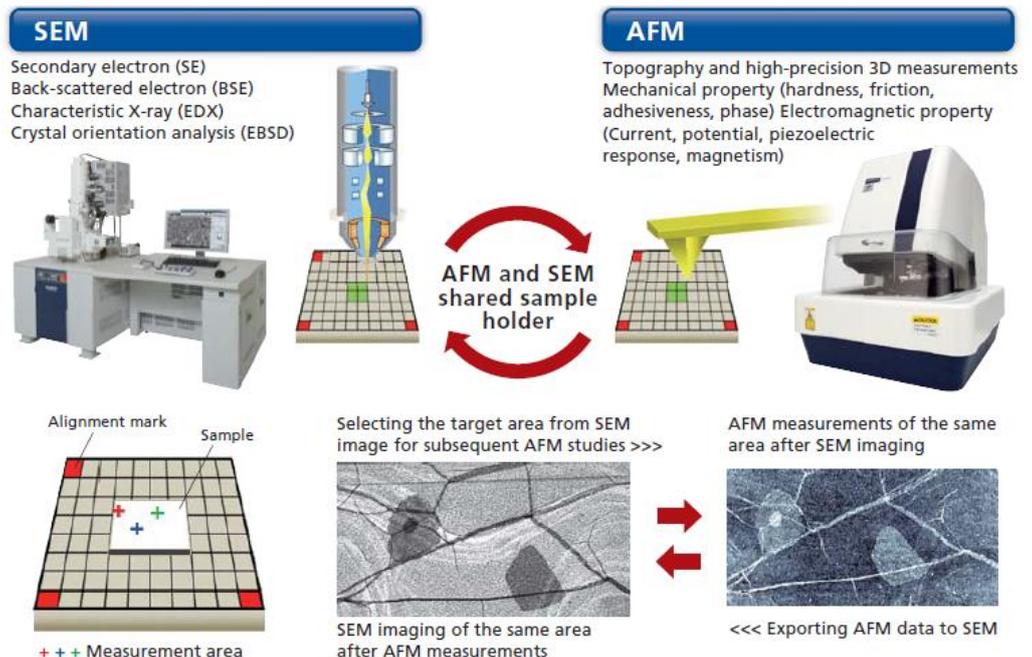
AFM5300E

Hitachi High-Technologies Corporation
Hitachi High-Tech Science Corporation
Tokyo, Japan
www.hitachi-hitec.com/global/science/
24-14, Hira-Sherazaki 1-chome, Atsuta-ku, Tokyo 105-0017, Japan
contact@hitec.hitec-hitec.com

AFM 5500



Un modèle pour petits et grands échantillons (platine 100mm motorisée), le 5500 assure un changement des cantilevers automatique. De très nombreux modes sont disponibles. Le 5500 est doté d'une fonctionnalité unique « SAEMIC » pour la corrélation parfaite d'images AFM et celles obtenues sur plusieurs modèles de MEB Hitachi dont le Regulus (MEB FEG Ultra Haute Résolution).



Nouveau nettoyeur plasma « ex-situ » sous vide ultime IBSS Group

Le Chiaro est une variante améliorée du MCA pour répondre aux exigences et aux méthodes innovantes d'observation au MET notamment pour les porte-échantillons utilisant des échantillons gazeux et liquides. Il permet entre autres le contrôle des fuites, des puces E-Chip, l'hydrophilisation de la surface des échantillons en plus du nettoyage par plasma. Le chargement des porte-échantillons MET, facilité par sa porte pivotante, peut être contrôlé en observant à travers la loupe binoculaire offrant jusqu'à x5 de grandissement. Le tout pouvant être enregistré via une caméra intégrée.



Besoin d'une upgrade vers Windows 10 ?

Nous avons la possibilité de faire évoluer un certain nombre de microscope électronique à balayage. Si cela vous intéresse, nous vous remercions d'adresser un email à info.physique@milexia.fr



Prix Ernst Ruska 2019



L'ensemble de l'équipe MILEXIA adresse ses sincères félicitations à **Florent Houdellier** (CEMES Toulouse), qui a été récompensé par l'attribution du **prix Ernst Ruska 2019**, pour sa participation au développement d'un nouveau microscope électronique à transmission à source pulsée ultrabrillante basée sur la technologie de l'émission « Cold FEG ».

Workshop/Web démo du Colloque GFSV



Lors des **journées du Groupe Français de Spectroscopie Vibrationnelle (GFSV)** qui ont eu lieu du 13 au 15 mai au centre Valpré, à Ecully, nous avons organisé avec notre fournisseur **Molecular Vista** une **web démo** du système **VISTA-IR**. Il s'agit d'un système de caractérisation de surface permettant, grâce à la technologie PiFM, de cartographier l'absorption infrarouge d'un échantillon en fonction de la longueur d'onde appliquée et de la position sur ce dernier. Une résolution à l'échelle nanométrique est alors atteinte permettant de mettre en évidence les emplacements de matériaux hétérogènes à la surface d'un échantillon.

Ce workshop fut un grand succès et a rassemblé plus de 80 participants. Merci à tous les participants !

Évènements à venir

2 au 5 juillet 2019

16ème colloque de la Société Française des Microscopies (SFμ) – ENSIP Poitiers

Le colloque de la SFμ rassemble la plus large communauté d'utilisateurs de microscopies (électronique, optique, à champ proche, sonde atomique tomographique...). Le programme de ce colloque s'articulera autour de 12 symposia que vous pouvez retrouver à partir de ce lien : [programme de la SFμ 2019](#). Certains symposia sont en communs avec les journées de printemps du GN-MEBA (voir le programme ci-dessous).

L'équipe Milexia sera à Poitiers pour le colloque de la SFμ ainsi que les journées de printemps du GN-MEBA. Nous aurons le plaisir de vous présenter notre dernière génération de MEB de table **Hitachi TM4000Plus** ainsi que trois équipements de préparations d'échantillons : le nettoyeur UV **Hitachi ZONE SEM**, le métalliseur et évaporateur sous vide secondaire **Quorum Q150T ES Plus**, ainsi que le nouveau nettoyeur plasma sous vide ultime **IBSS Chiaro**.



MEB de table Hitachi
TM4000Plus



Nettoyeur UV Hitachi
ZONE SEM



Métalliseur/évaporateur
sous vide secondaire
Quorum Q150T ES Plus



Nettoyeur plasma « ex-situ »
IBSS Chiaro

3 au 4 juillet 2019

Journées de printemps du GN-MEBA – ENSIP Poitiers

Les prochaines journées de printemps auront lieu en parallèle avec le 16ème colloque de la Société Française des Microscopies. Le programme de ces journées est disponible en cliquant [ici](#).

23 au 26 septembre 2019

ESREF – Centre de congrès Pierre Baudis, Toulouse

L'ESREF organise son 30^{ème} Symposium Européen sur la Fiabilité des Dispositifs Electroniques, la Physique de Défaillance et l'Analyse au centre de Congrès Pierre Baudis, à Toulouse. Ce symposium international se concentre sur les développements récents et les orientations futures en matière de gestion de la qualité et de la fiabilité des matériaux, des dispositifs et des circuits pour la micro, la nano et l'optoélectronique. Nous accompagnerons **Hitachi Power Solutions** lors de cet évènement.

24 au 26 septembre 2019

CIM – Porte de Versailles, Paris

Le Congrès International de Métrologie rassemble biennalement tous les acteurs dans le domaine métrologie. Il s'agit à la fois d'un congrès sur les évolutions des technologies et processus de mesure et d'un lieu de rencontre entre industriels, experts et scientifique.

Pour ce congrès, nous vous informerons des équipements que nous exposerons dans les prochaines E-Actu.